

| 試験項目 | | 項目名称 | 説明 | 規格対応 | 試験単位 | 項目コード | 料金 | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|---|--|------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 中小 | 一般 | |
| X線光電子分光分析 | X線光電子分光分析装置 (XPS) | 基本料金 | エックス線光電子分光分析装置によるもの (ワイドスキャン測定) | X線を試料表面に照射し、最表層(数nm)から放出される光電子を観測します。構成元素に由来したスペクトルを計測することで、表面状態(元素濃度比や化学結合状態)を分析できます。 | NA | 1測定につき | T634111 | ¥17,900 | ¥34,950 |
| | | 基本料金 | エックス線光電子分光分析装置によるもの (ナロースキャン測定) | | NA | 1試料1時間につき | T634211 | ¥18,950 | ¥35,060 |
| | | 同一試験の追加料金 | エックス線光電子分光分析装置によるもの (ナロースキャン測定 同一試料の追加) | | NA | 1時間につき | T634212 | ¥6,140 | ¥12,280 |
| | | 基本料金 | エックス線光電子分光分析装置によるもの (深さ方向分析) | | NA | 1試料1時間につき | T634311 | ¥22,060 | ¥40,530 |
| | | 同一試験の追加料金 | エックス線光電子分光分析装置によるもの (深さ方向分析、同一試料の追加) | | NA | 1時間につき | T634312 | ¥6,140 | ¥12,280 |
| 飛行時間型二次イオン質量分析 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置 (ToF-SIMS) | 基本料金 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの (通常測定) | イオンを試料表面に照射し、再表層からはじき出されたイオンの質量数を計測します。計測されたイオンの質量数から、表面の構成元素や結合状態を分析できます。 | NA | 2時間以内 | T636111 | ¥27,720 | ¥52,270 |
| | | 同一試験の追加料金 | 飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの (通常測定 同一試験の追加) | | NA | 30分につき | T636112 | ¥4,240 | ¥8,080 |
| | | 同一試験の追加料金 | 験 飛行時間型二次イオン質量分析装置によるもの (追加解析) | | NA | 30分につき | T636211 | ¥1,320 | ¥2,910 |

*料金単価は1円単位ですが、請求時には合計金額の10円未満は切り捨てます。
*下記のように、御業種によって料金が異なります。ご確認ください。

| 適用料金 | 業種等 | 資本金又は従業員数 |
|--------|-------------------|--|
| 一般料金 | | 中小企業基本法第2条に定める中小企業(下記要件を参照)以外の企業、一般財団法人・一般社団法人、NPO法人、国・都道府県・区市町村等自治体、独立行政法人、大学、専門学校、個人など |
| 中小企業料金 | 小売業 | 資本金5千万円以下又は従業員50人以下の会社、個人事業者 |
| | サービス業 | 資本金5千万円以下又は従業員100人以下の会社、個人事業者 |
| | 卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下の会社、個人事業者 |
| | 製造業・その他 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下の会社、個人事業者 |
| | 中小企業団体 | 中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づき設立された法人あるいは団体、中小企業者からなる団体 |
| | 当センター理事長が必要と認めた場合 | 公益財団法人又は公益社団法人 業務提携等の協定に基づく事業(業務提携事業) |